## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ

УДК 541.135.4

# ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛА $Bi_{12}(V,Bi)O_{20+\delta}$ ( $\delta = 0.27$ ) СО СТРУКТУРОЙ ТИПА СИЛЛЕНИТА

## © 2012 г. Н. И. Сорокин

Институт кристаллографии РАН, Москва E-mail: sorokin@ns.crys.ras.ru Поступила в редакцию 01.03.2012 г.

Методом импедансной спектроскопии исследована ионная проводимость нестехиометрического монокристалла  $Bi_{12}(V_{0.89}Bi_{0.03})O_{20.27}$  со структурой типа силленита, значение проводимости которого при 673 К равно 2 ×  $10^{-3}$  См/см, что на ~2 порядка выше электропроводности монокристалла оксидного суперионного проводника  $Zr_{0.88}Y_{0.12}O_{1.94}$ . Из кристаллохимического анализа следует, что ионный транспорт в  $Bi_{12}(V_{0.89}Bi_{0.03})O_{20.27}$  обусловлен дополнительными ионами  $O^{2-}$ , возникающими вследствие кислородной нестехиометрии.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Индивидуальные соединения  $Bi_{12}MO_{20}$  ( $M^{4+}$  = = Si<sup>4+</sup>, Ge<sup>4+</sup>, Ti<sup>4+</sup>) со структурой типа силленита образуются при взаимодействии оксида висмута с оксидами элементов, способных иметь четверную координацию по кислороду. Кристаллы Ві<sub>12</sub>МО<sub>20</sub> изоструктурны метастабильной объемоцентрированной кубической форме у-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (пр. гр. 123), обладают диэлектрическими свойствами и характеризуются разнообразием физических эффектов (пьезоэлектрическим, электро- и магнитооптическим, оптической активностью, фотопроводимостью и фоторефракцией) [1]. В кристаллах Bi<sub>12</sub>MO<sub>20</sub> тетраэдрические позиции М могут быть статистически заселены изоморфными смесями катионов  $M^{n+}$  (n = 2-5) с сильно различающимися ионными радиусами, что приводит к обширному классу нестехиометрических силленитов (твердых растворов)  $Bi_{12}M_xO_{20+\delta}$ .

На атомарном уровне механизмы необычайно широкого изоморфизма по катионам M в кристаллах  $\operatorname{Bi}_{12}M_xO_{20\pm\delta}$  рассмотрены в [2]. Показано, что решающую роль в существовании обширного класса изоморфных соединений типа силленита играет висмут-кислородная подрешетка. Особенности структуры силленитов определяются степенью окисления M-катионов. Замена катионов одного сорта  $M^{4+}$  изоморфными смесями катионов  $M^{2+}$ ,  $M^{3+}$ ,  $M^{4+}$  и  $M^{5+}$  приводит к кислородной нестехиометрии соединений  $\operatorname{Bi}_{12}M_xO_{20\pm\delta}$  за счет образования вакансий кислорода в позициях 8*c* пр. гр. *I*23 или размещения дополнительного кислорода в позициях 6*b*.

В [3] рассмотрены модели строения разных нестехиометрических кристаллов семейства силленита в системе  $Bi_2O_3 - V_2O_5$  и установлена принципиальная возможность нахождения атомов Bi в центрах тетраэдров [BiO<sub>4</sub>]. Среди исследованных ванадийсодержащих силленитов особый интерес представляет единственный кислород-избыточный твердый раствор  $Bi_{12}(V_{0.89}^{5+}Bi_{0.03}^{3+})O_{20.27}$ , кристаллическое строение которого детально изучалось [4] методом прецизионного нейтронографического исследования. Нейтронографический метод позволил надежно установить структурные параметры атомов кислорода и с большой точностью определить процентное содержание катионов V и Bi в тетраэдрической позиции структуры. Найдено, что в не полностью заселенных тетраэдрических позициях M находятся трехвалентные катионы висмута и эффективная усредненная валентность катионов M равна 4.54+.

Цель настоящей работы — исследование электропроводности нестехиометрического монокристалла  $Bi_{12}(V_{0.89}Bi_{0.03})O_{20.27}$  и выявление связи между процессом электропроводности и атомным строением этого кристалла.

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Монокристаллы получены методом гидротермального синтеза, который проводили путем взаимодействия V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (из щелочных растворов) при 300°С и давлении ~5 × 10<sup>7</sup> Па с последующей перекристаллизацией кристаллов спонтанного зарождения на затравку. Оранжевый цвет выращенных монокристаллов обязан присутствию ионов V<sup>5+</sup>. Монокристаллы структурно аттестованы методом нейтроноструктурного анализа [4] в Институте кристаллографии РАН. Они принадлежат к структурному типу силленита (пр. гр. *I*23) с параметром элементарной ячейки *a* = 10.247(8) Å [4] и пикнометрической плотностью  $\rho = 8.89$  г/см<sup>3</sup> [5] (для сравнения соответствующие характери-



**Рис. 1.** Температурные зависимости ионной проводимости монокристаллов  $Bi_{12}(V_{0.89}Bi_{0.03})O_{20.27}$  (*1*) и  $Zr_{0.88}Y_{0.12}O_{1.94}$  (*2*).

стики  $\gamma$ -Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> a = 10.245(1) Å и  $\rho = 9.239$  г/см<sup>3</sup>). Уточненный в структурных исследованиях [4] состав монокристаллов Bi<sub>12</sub>(V<sup>5+</sup><sub>0.89</sub>Bi<sup>3+</sup><sub>0.03</sub>)O<sub>20.27</sub> (полная структурная формула Bi<sub>12</sub>(V<sup>5+</sup><sub>0.89</sub>Bi<sup>3+</sup><sub>0.03</sub>)O<sub>20</sub>O<sub>*i*(0.27)</sub>, где  $\Box$  – вакансия в позиции M, O<sub>*i*</sub> – дополнительная позиция кислорода) хорошо согласуется с его пикнометрической плотностью.

Для электрофизических измерений приготовлен образец в виде прямоугольного параллелепипеда высотой 2.5 мм, имеющий площадь основания 15 мм<sup>2</sup>. Ориентировка образца относительно кристаллографических осей не проводилась, поскольку он относится к кубической сингонии. Электропроводность о находилась из анализа частотных зависимостей комплексного импеданса в диапазоне частот 5 Гц-500 кГц (импедансметр Tesla BM-507). Относительная погрешность измерений импеданса составляла <5 %. В качестве электродов использовали графитовую пасту Dag-580. Электрофизические измерения проводили в вакууме 10<sup>-1</sup> Па в интервале температур 488-723 К. Величину σ определяли экстраполяцией годографа импеданса на ось активных сопротивлений с учетом геометрии образца. Наблюдаемая электродная поляризация на низких частотах в спектрах импеданса электрохимической ячейки Скристалл С с необратимыми электродами указывает на ионную природу электропроводности изученного кристалла.



Рис. 2. Схема модели строения кристалла  $Bi_{12}(V_{0.89}^{5+}Bi_{0.03}^{3+})O_{20.27}$ .

На рис. 1 показана температурная зависимость  $\sigma$  монокристалла  $\text{Bi}_{12}(V_{0.89}\text{Bi}_{0.03})O_{20.27}$ , а также для сравнения приведены данные [5] по ионной проводимости монокристалла оксидного суперионного проводника  $\text{Zr}_{0.88}\text{Y}_{0.12}\text{O}_{1.94}$ . Для кристалла  $\text{Bi}_{12}(V_{0.89}\text{Bi}_{0.03})O_{20.27}$  при 673 К (400°С) значение  $\sigma = 2 \times 10^{-3}$  См/см, что на ~2 порядка выше проводимости монокристалла  $\text{Zr}_{0.88}\text{Y}_{0.12}\text{O}_{1.94}$ . На кривой  $\sigma(T)$  изломов не наблюдается и она описывается уравнением типа Аррениуса  $\sigma = (A/T)\exp(-\Delta H/kT)$ , где предэкспоненциальный множитель проводимости  $A = 8.1 \times 10^6$  СмК/см и энтальпия активации миграции носителей заряда  $\Delta H = 0.91$  эВ.

Схема модели строения кристалла  $Bi_{12}(V_{0.89}^{5+}Bi_{0.03}^{3+})O_{20.27}$  [6] представлена на рис. 2. Атомы Bi(1) находятся в позиции 24f с координатами *x*, *y*, *z* (*x* ~ 0.17, *y* ~ 0.32, *z* ~ 0.01), атомы Bi(2) и V — в позиции 2a с координатами 0,0,0. Атомы кислорода занимают четыре разные правильные системы точек: O(1) в позиции 24f с координатами *x*, *y*, *z* (*x* ~ 0.13, *y* ~ 0.25, *z* ~ 0.49), O(2) и O(3) в позиции 8*c* с координатами *x*, *x*, *x* с *x* ~ 0.2 и *x* ~ 0.9 соответственно, О(4) в позиции 6b с координатами 0.5, 0, 0. Атомы кислорода связаны с атомами Ві и V ионно-ковалентными связями из-за высокой электроотрицательности атома кислорода. Структура твердого раствора Bi<sub>12</sub>(V<sub>0.89</sub>Bi<sub>0.03</sub>)O<sub>20.27</sub> относится к каркасному типу. Каркас образуют димеры из [Bi(1)O<sub>5</sub>] (искаженный полуоктаэдр), которые соединяются с помощью тетраэдров  $[VO_4]$  и  $[Bi(2)O_4]$ . В их состав входят атомы кислорода О(3), расположенные вокруг тетраэдрической позиции М (рис. 2). Дополнительный атом О(4) помещен в центре полости, образованной двумя димерами. Расстояние от кислорода O(4) до четырех ближайших атомов Ві составляет 2.58 Å, соседние атомы О удалены от него на расстояния, большие 2.88 Å. Наблюдаемые в струк-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 57 № 6 2012

туре вакансии в тетраэдрических позициях *М* демфируют напряжения, возникающие вблизи дополнительных атомов O(4).

Результаты нейтроноструктурного исследования [4] показывают практически полное заселение тетраэдрической позиции в структуре изученного силленита ванадием и наличие дополнительного кислорода. Вхождение в структуру кислородов О(4) является причиной аномального увеличения параметра элементарной ячейки по сравнению с кислород-дефицитными ванадийсодержащими силленитами. Появление в структуре дополнительных атомов кислорода О(4) – совершенно новая особенность, обнаруженная для кристаллов типа силленита (в стехиометрических и кислород-дефицитных силленитах атомы О(4) отсутствуют), и она связана с необходимостью компенсации заряда катионов V<sup>5+</sup>. Если бы тетраэдрическая позиция М была полностью занята катионами V<sup>5+</sup>, то для компенсации заряда это привело бы к заполнению правильной системы точек 6b атомами O(4) на 1/6 (в одной элементарной ячейке из шести позиций заселялась бы одна). В данном случае коэффициент заполнения этой позиции почти вдвое меньше. Статистическое заселение дополнительными атомами O(4) позиций 6b, свободных в идеальном силлените, позволяет высказать следующую гипотезу. Ионный транспорт в нестехиометрических кристаллах  $Bi_{12}(V_{0.89}Bi_{0.03})O_{20.27}$  обусловлен дополнительными ионами кислорода O(4) в позициях 6*b* пр. гр. *I*23, возникающими вследствие кислородной нестехиометрии.

Автор выражает благодарность С.Ф. Радаеву за предоставление монокристалла для проведения электрофизических измерений.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Каргин Ю.Ф., Бурков В.И., Марьин В.И., Егорышева А.В. Кристаллы со структурой силленита. Синтез, строение и свойства. М.: ИОНХ РАН, 2004. 316 с.
- 2. *Радаев С.Ф., Симонов В.И.* // Кристаллография. 1992. Т. 37. № 4. С. 914.
- 3. *Радаев С.Ф., Мурадян Л.А., Сарин В.А. и др. //* Докл. АН СССР. 1989. Т. 307. № 3. С. 606.
- 4. *Каргин Ю.Ф., Марьин В.И., Скориков В.М. //* Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1982. Т. 18. № 10. С. 1605.
- 5. *Сорокин Н.И.* // Электрохимия. 2000. Т. 36. № 3. С. 357.
- 6. Мельникова Т.И., Кузьмичева Г.М., Рыбаков В.Б. и др. // Кристаллография. 2011. Т. 56. № 2. С. 252.